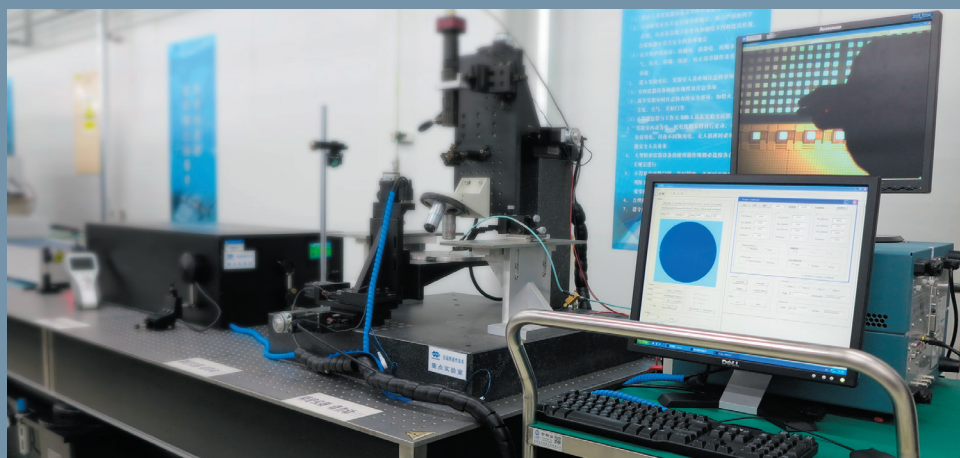


# 激光模拟单粒子效应测试系统

Laser Simulation Single Event Effects Testing System



LaPsee - I



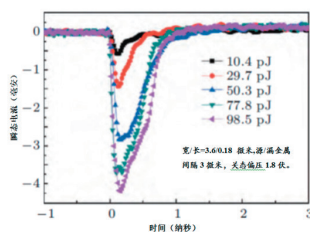
## 主要技术与性能指标

- 脉冲宽度 (FWMH) :  $< 25 \text{ ps}$
- $3\sigma$  稳定性:  $< 10\%$
- 光斑大小:  $1.2 \mu\text{m}@532 \text{ nm}$ 、 $1.4 \mu\text{m}@1064 \text{ nm}$

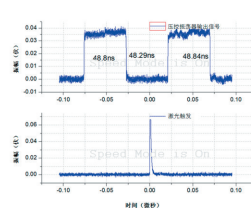
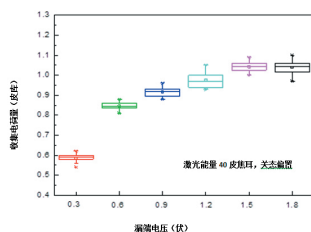
## 主要应用

用于模拟空间粒子对电子元器件的影响, 为电子元器件抗单粒子性能评估及加固技术提供测试方法

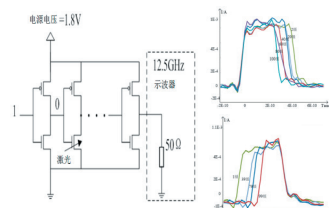
## 代表性应用成果



超快单粒子瞬态脉冲直接测量研究



模拟电路宽度变化测量



180 nm SOI 电路单粒子瞬态宽度测量

主要用户单位	中国空间技术研究院、中国电子科技集团、西安电子科技大学, 以及中国科学院部分研究所
研制单位	中国科学院微电子研究所
联系方式	倪涛 010-82995976, 13488665816 nitao@ime.ac.cn